

## 八氧化三铀中硅之光谱载带测定法

@顾国英 @张仲生 @高炳华

收稿日期 1965-2-19 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** 本工作采用光谱载带法分析U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>中的Si含量。在ИСП-28中型谱仪上工作,激发光源为直流电弧。工作中就分馏效应、工作曲线、再现性和实际样品分析数据四个方面比较了AgCl,Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和NaF三种载体;考察了Si 2435.16 ,2506.90 和2881.58 三条谱线。实验数据说明:采用50:1(样品:载体)的NaF载体量,选用2435.16 作分析线来测定U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>中的Si含最能得到满意的分析结果。

关键词

分类号

### 扩展功能

#### 本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(252KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

### Abstract

### Key words

DOI

通讯作者